



Warszawa, dnia 2.6.2010 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 1163 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: **„Dostawę urządzenia do obróbki skupioną wiązką jonów (Focused Ion Beam – FIB) dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.”** Nr WF-37-20/10; UW/04/NANO/2

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Szanowni Państwo,

W związku z wymaganiami określonymi w dokumentacji SIWZ do w/w przetargu, w części 3.1 „Opis przedmiotu zamówienia”, precyzującym minimalne i konieczne do spełnienia wymagane techniczne, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy dopuszczają Państwo do dalszej oceny zaoferowanie instrumentu głównego (urządzenia do trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB) zintegrowanego z wysokorozdzielczym skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM)), wyposażonego w wewnątrz-soczewkowy detektor elektronów wtórnych oraz elektronów rozproszonych wstecz oraz dodatkowy poza-soczewkowy detektor elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań, które zostały określone w punkcie dotyczącym tego elementu?

Komentarz: Proponowany system mikroskopu SEM/FIB, który chcemy Państwu zaoferować, wyposażony jest w zintegrowany układ detektora pozwalającego na wewnątrzsoczewkową detekcję zarówno sygnału SE jak i BSE. Jako uzupełnienie naszej propozycji oferujemy dodatkowy detektor elektronów wtórnych (oraz wstecznie rozproszonych) montowany w komorze mikroskopu (poza nabiegunnikiem) – zoptymalizowany do pracy przy większych odległościach roboczych.

Proponowana kombinacja detektorów jest rozwiązaniem optymalnym dla różnych warunków pracy mikroskopu oraz zapewnia możliwość ultra wysokorozdzielczego obrazowania preparatów z wykorzystaniem SEM.

2. Czy punkty 3.4.2 oraz 3.4.3 opisujące szczegółowo parametry stolika preparatu muszą być spełnione jednocześnie, czy też dopuszczają Państwo zaoferowanie w miejsce jednego stolika dwóch, które będą odpowiednio spełniały wymagania z punktu 3.4.2 (stolik nr 1) oraz 3.4.3 (stolik nr 2)?



INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTEC
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Szwedowskiej



UNIwersytet Warszawski

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa



Komentarz: Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam dobrać rozwiązanie najbardziej dopasowane do Państwa potrzeb i aplikacji.”

Odpowiadamy:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza realizację wewnątrzsoczewkowej detekcji elektronów rozproszonych wstecz (BSE) i elektronów wtórnych (SE) – wymagania zapisane w art. 3 ust 3 pkt 3.3.2 oraz 3.3.3 SIWZ – za pomocą pojedynczego detektora. **Nie jest wymagane** zainstalowanie odrębnych detektorów wewnątrzsoczewkowych do detekcji elektronów rozproszonych wstecz i elektronów wtórnych. Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 3.3.1 SIWZ wymagane jest zainstalowanie w komorze mikroskopu pozasoczewkowego detektora umożliwiającego co najmniej detekcję elektronów wtórnych (SE).

Ad. 2

Wymagania dotyczące stolika sformułowane w art. 3 ust 3 pkt 3.4.2 i 3.4.3 SIWZ **muszą być spełnione łącznie**, tzn. należy dostarczyć stół odpowiadający równocześnie wszystkim wymienionym w tych punktach warunkom.

KIEROWNIK ZAPŁADU
FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

N _____

Prof. dr hab. Michał Nawrocki



INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN